



## 34. Workshop

# Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

27.02. - 01.03.2022, Bremerhaven

### Call for Papers

#### Programmkomitee

**J. Alt**  
Infineon Technologies AG

**W. Anheier**  
Universität Bremen

**B. Becker**  
Universität Freiburg

**R. Drechsler**  
Universität Bremen und DFKI GmbH

**S. Eggersglüß**  
Siemens Digital Industries Software

**P. Engelke**  
Infineon Technologies AG

**G. Fey**  
Technische Universität Hamburg

**A.-P. Fonseca-Müller**  
Bosch Sensortec GmbH

**M. Gössel**  
Universität Potsdam

**S. Hellebrand**  
Universität Paderborn

**K. Hofmann**  
Technische Universität Darmstadt

**S. Holst**  
Kyushu Institute of Technology

**W. Hoppe**  
Rheinmetall AG

**F. Hopsch**  
Fraunhofer IIS EAS Dresden

**S. Huhn**  
Universität Bremen und DFKI GmbH

**R. Krenz-Baath**  
Hochschule Hamm-Lippstadt

**M. Krstic**  
Universität Potsdam und IHP GmbH

**V. Petrovic**  
Robert Bosch GmbH

**I. Polian**  
Universität Stuttgart

**F. Pöhl**  
Apple Inc.

**S. Sattler**  
Universität Erlangen-Nürnberg

**M. Sauer**  
Advantest Europe GmbH

**M. Schillinsky**  
NXP Semiconductors Germany GmbH

**J. Schlöffel**  
Siemens Digital Industries Software

**H. Schmidt**  
IBM Deutschland GmbH

**M. Schölzel**  
Hochschule Nordhausen

**J. Sepulveda**  
Airbus Defence and Space

**M. Tahoori**  
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)

**D. Tille**  
Infineon Technologies AG

**M. Wahl**  
Universität Siegen

**H.-J. Wunderlich**  
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen sowie Systemen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen.

Beiträge zu folgenden und weiteren Themen werden erbeten:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und maschinelle Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Systemtest und -zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE P1838

Der Workshop findet im **ATLANTIC Hotel Sail City Bremerhaven** statt und wird von der Universität Bremen und der Technischen Universität Hamburg-Harburg organisiert. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen. Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.

Um einen freien Austausch von Ideen und Informationen zu erleichtern, sind während des Workshops Video- und Audioaufzeichnungen nicht gestattet. Die Beiträge und Vorträge auf dem Workshop sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache willkommen. Das organisatorische Rahmenprogramm findet auf Englisch statt.

**Workshop-Homepage:** <http://www.tuz-workshop.de>

#### Einreichung der Beiträge:

max. 2 Seiten bis spätestens **19. November 2021** über die Workshop-Homepage

#### Veranstalter

GI FA 3.5 / GMM FA 6.5 / ITG FA 8.2



RSS Kooperationsgemeinschaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf

#### Tagungsleitung

Dr.-Ing. Sebastian Huhn  
Senior Researcher  
Universität Bremen  
Bibliothekstraße 5  
28359 Bremen  
E-Mail: [huhn@uni-bremen.de](mailto:huhn@uni-bremen.de)

#### Wissenschaftliche Tagungsleitung

Prof. Dr.-Ing. Görschwin Fey  
Professor für Technische Informatik  
Technische Universität Hamburg  
Am Schwarzenberg-Campus 3 (E)  
21073 Hamburg  
E-Mail: [goerschwin.fey@tuhh.de](mailto:goerschwin.fey@tuhh.de)